

2025年3月吉日

お客様各位

株式会社 日立ハイテクフィールドディング  
コアテクノロジーサービス本部  
解析装置部

日立ハイテク解析製品 アプリケーションサービス料金改定の移行期間終了のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄の段、お喜び申し上げます。平素より日立ハイテク製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。題記、サービス料金改定の移行期間終了につきましてご連絡させていただきますのでご理解の程、お願い申し上げます。

2024年4月1日にご案内いたしました日立ハイテク及び日立ハイテクサイエンス製解析装置サービス料金改定に際し、アプリケーションサービス料金については暫定的にサービス料金を据置とする移行期間を設けさせていただいておりましたが、この度移行期間を終了し2025年4月1日より下記のとおり新サービス料金にて承ります旨改めてご案内いたします。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。今後ともお客様に寄り添った安定したサービス品質をご提供することによりお客様装置の安定稼動、価値向上に努力して参りますので、引き続きご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。

敬具

記

1. 価格改定時期:2025年4月1日(月)新規見積発行分から
2. 対象製品:日立ハイテク製走査電子顕微鏡および周辺機器
3. 価格改定の内容:従来料金体系より、別表の通り変更させていただきます。
4. 御社値引き金額:従来通りの値引き率を適用し、お見積りを致します。

本内容に関するお問い合わせ:

〒105-6410 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー  
(株) 日立ハイテクフィールドディング コアテクノロジーサービス本部  
解析装置部  
TEL:0120-203-813

別表

アプリケーションサービス(事前見積)のサービス料金体制について

- ・技術料(1工数)について、従来の全製品一律の料金体制より製品カテゴリ別料金体制に変更させていただきます。
- ・弊社請負サービス拠点よりお客様納入先迄の移動に要する費用を、別途派遣費としてご請求させていただきます。

アプリケーションサービス料金体系(技術料)

製品カテゴリ	変更前	変更後
電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	一律	技術料 A
走査電子顕微鏡(SEM)、卓上顕微鏡(TM)、イオンミリング装置(IM)		技術料 B

※集束イオンビーム加工観察装置(FIB)、FIB-SEM 複合装置(FIB-SEM)、走査プローブ顕微鏡(AFM)、白色干渉顕微鏡(CSI)におけるアプリケーション技術料金体制は変更ありません。

-以上-